

Auto Four-Point Probe for Sheet Resistance Measurement

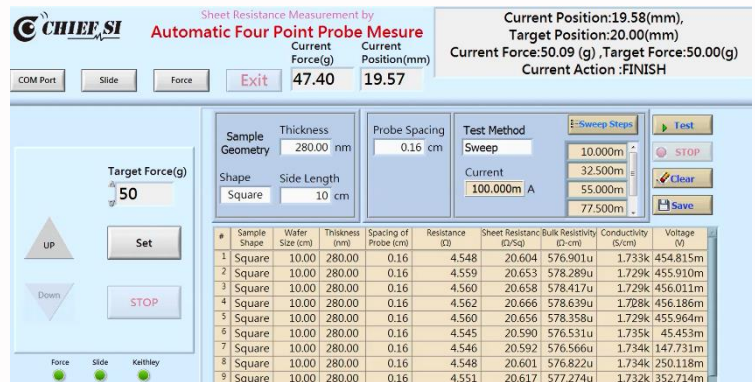


系統規格

Chuck Size	6" , 8" , 12"
Sample Geometry	Circle or Square
Head Up / Down	16mm
Force Control	100g
Correct Factor	Thickness & Geometry
Probe Pin Material	BeCu(or Tungsten Carbide)
Probe Pin Spacing	40mil, 50mil, 62.5mil
Probe Pin Spring	45grams, 85grams, 180grams
Measure Item	Sheet Resistance, Bulk Resistivity, Conductivity
Interface	RS-232 or GPIB
Language	English
PC Requirements	CPU:P4, HD:1GB, USB 2.0
Monitor Requirements	1280*800 resolution
O.S. Supported	WIN7/WIN10
SMU Support	Keithley 2400/2401



機台側面



軟體畫面

快速而直覺化的自動四點探針薄膜電阻量測系統

運用四點探針測量原理，量測各式片狀、塊狀之導體、半導體材料以及導電薄膜之薄膜電阻(Sheet Resistance，又稱薄層電阻、片電阻)。搭配高精度的自動四點探針台，可自動下針並且控制下針的微力，可輕易量得材料之薄膜阻抗，並廣泛運用於半導體、太陽能、OLED、微機電、燃料電池等各式產業上。

系統特色

- 方便易上手，直覺化的軟體操作介面。
- 自動下針加上 100g 微力反饋。
- 精密量測待測物之薄膜電阻。
- 定電流量測，可選擇單點量測或多點掃描。
- 已知薄膜厚度之情況下，同時推算出體電阻率與導電率。
- 採用 CSV 檔案儲存格式，方便使用者進行資料處理。預設搭配 Keithley 2400 SMU。亦可依使用者需求，配合各式 SMU 與微歐姆計、高阻計客製化操作軟體。

